



2.2 – Condições de Calibração e Leituras

Modo: Leitura simples pontual em absorbância

Feixe: Duplo

Slit: 1 nm

Zeragem: Ar

2.3 – Valores Certificados

Filtro	Absorbâncias nos seguintes comprimentos de onda à 25°C - Slit 1 nm				
	440 nm	465 nm	546 nm	590 nm	635 nm
666-F2-NG11	0,263 \pm 0,004	0,231 \pm 0,004	0,233 \pm 0,004	0,250 \pm 0,004	0,252 \pm 0,004
666-F3-NG5	0,504 \pm 0,005	0,463 \pm 0,005	0,468 \pm 0,005	0,514 \pm 0,005	0,515 \pm 0,005
666-F4-NG4	1,006 \pm 0,007	0,933 \pm 0,007	0,944 \pm 0,007	1,000 \pm 0,007	0,969 \pm 0,007

As incertezas expandidas (U) declaradas para intervalo de confiança de 95% , correspondem a soma das incertezas dos padrões primários NIST, reprodutibilidade das medidas e erros sistemáticos do instrumento.

3 – Filtro de Comprimento de Onda

3.1 – Metodologia Utilizada

As leituras de comprimento de onda (λ) do filtro de holmio foram registradas em espectrofotômetro de alta resolução, número de série EL99093040, previamente calibrado com padrão NIST e usando procedimento de controle de desempenho do fabricante .

O seguinte padrão NIST foi utilizado para calibrar o instrumento:

SRM 2034 – “Holmium Oxide Solution Wavelength Standard from 240 nm to 650 nm”

3.2 – Condições de Calibração e Leituras

Modo: Transmittância

Slit: 1 nm

Velocidade: 30 nm/min

Feixe: Duplo

Zeragem: Ar utilizando

Intervalo: 0,02 nm